

半導体自動特性評価ソフトウェアの パワー半導体デバイス評価、WLR テスト機能を強化

テスト開発時間の短縮、様々な信頼性テストが実行可能になり、研究／開発の生産性が向上

[ケースレーンストルメンツ](#) (代表取締役 木下 伸二、以下、ケースレー) は、本日、ACS (Automated Characterization Suite、半導体特性評価ソフトウェア) バージョン 5.2 を発表します。

エネルギー効率改善のニーズに伴い、発電、給電、電力消費に関連して新しい半導体技術の開発が進んでいます。炭化ケイ素 (SiC) や窒化ガリウム (GaN) などの新しい材料を採用する場合、完全に商品化される前に研究／開発段階で新しい測定や詳細な特性評価が必要になります。このような新しい要求に応えるため、ACS 最新リリース (バージョン 5.2) では、半導体パワー・デバイスの開発／特性評価のための数多くのテスト、デバイス開発／プロセス品質改善のための WLR (Wafer Level Reliability) テストをサポートします。この強化により、ソフトウェアの柔軟性が向上し、数多くのアプリケーションをサポートできるようになります。例えば、高電圧の C-V 測定ライブラリが追加されました。このライブラリを使用することで、複数の端子を持つ DUT の複数のキャパシタンスの値を含む、パワー半導体デバイスの詳細な特性評価が可能になります。

また、ACS の V_{DS} WLR サンプル・プロジェクトでは、2657A 型ハイパワー・システム・ソースメータ (SMU) のソース／シンクが 3000V までサポートできるようになりました。これにより、ACS ベースのシステムは 2657A 型を含むことができ、広範囲のテスト、DUT に対応できます。同じ目的のために、10kV の新製品 2290 型電源のサポートも追加されました。さらに、WLR テストのループ機能とグラフィカル・ユーザ・インターフェースも強化しており、シンプルな GUI で、より効果的なテストが行えます。テストの開発時間が短縮でき、さまざまなデバイスの信頼性テストが実行できるため、研究／開発の生産性が向上します。

2007 年に発表された ACS は、半導体デバイスの特性評価、信頼性テスト、パラメトリック・テスト、コンポーネント機能テストのために設計された、柔軟性に富んだ、対話形式のソフトウェア・テスト環境です。対話形式によるマニュアルでの詳細測定から自動ウェハ・プローバによる測定まで、広範囲な事例に対応できるように設計されています。ACS は、ケースレーの S500 シリーズ、S530 シリーズ・パラメトリック・テスト・システムを含む、数多くのケースレー製品をサポートしています。

ACS ソフトウェアとサポートする機器の詳細については、ケースレーのウェブ・サイト

(<http://www.keithley.jp/products/semiconductor/characterizationsoftware>) をご覧ください

ケースレーインストゥルメンツについて

ケースレーはテクトロニクス・ファミリーの一員であり、高性能製造テスト、プロセス監視、製品開発、研究を行う電子機器製造メーカー独自のニーズに対応した、最新の電気テスト機器／システムを提供しています。DC（直流）またはパルス状の電気信号のソース、測定、接続、制御、通信で使用される、500種類近くの製品をラインアップしています。ケースレーのお客様は、世界規模のエレクトロニクス業界の科学者／エンジニアが中心であり、最新の材料研究、半導体デバイスの開発と製造、携帯無線デバイスなどの最終製品の製造に携わっています。詳しくはウェブ・サイト(<http://www.keithley.jp/>)をご覧ください。

お客さまからのお問合せ先

テクトロニクス／ケースレーインストゥルメンツ お客様コールセンター

TEL 0120-441-046 FAX 0120-046-011

URL <http://www.keithley.jp/contact>

報道関係者からのお問合せ先
テクトロニクス／ケースレーインストゥルメンツ
広報室 瀬戸 厚子
電話：03(6714)3097 Fax：03(6714)3667
Email: seto.atsuko@tektronix.com

KEITHLEY は、Keithley Instruments, Inc.の登録商標です。本文に記載されているその他すべての商標名および製品名は、各社のサービスマーク、商標、登録商標です